

# 紫外分光光度计

中文名称:	紫外分光光度计
英文名称:	UV-VIS SPECTROPHOTOMETER
资产编号:	02192280
放置位置:	日本/HITACHI
生产厂家:	柔性电子制造实验室
实验负责人:	张翁晶、朱倩倩



## ● 主要功能

紫外分光光度计用于光学元器件产品及特定尺寸光学镜头类产品的透过率、反射率精密测试，能够较全面的跟踪、分析和评估光学类产品的光谱特性，能够进行高分辨率多维光学成像元器件的数据误差溯源。

## ● 系统特点

紫外分光光度计配备大样品仓，可进行大样品无损测试，无需改变光路即可进行各种附件的耦合。高性能棱镜-光栅双单色器系统可实现底杂散光和低偏振，对低透过率和低反射率样品也可实现低噪音测定。采用平行光束，可实现高精度镜面反射率的测定，特别适合 LED 材料、棱镜及透镜的测定。

## ● 主要参数

- 1、单色器：高分辨率机刻凹面衍射光栅
- 2、大样品仓：680\*470\*300mm
- 3、波长设定范围：185-3300nm
- 4、Φ60mm 积分球检测器，开口率小于 7.8%
- 5、光谱带宽：紫外可见区：0.01-8.0nm，近红外区域：0.1-20nm
- 6、光源：氙灯（紫外区域），卤钨灯（可见·近红外区域）
- 7、波长准确性：±0.2nm（紫外/可见区），±1.0nm(近红外区)

## ● 应用示例

### ■ Analytical Conditions

Instrument	Model UH4150 Spectrophotometer
Measurement wavelength range	300~800 nm
Scan speed	300 nm/min
Slit	8 nm
Sampling interval	1 nm
Standard reflective material	Aluminum plane mirror

### ■ Accessory

- Φ60 Standard Integrating Sphere (for total reflectance) (P/N: 1J1-0121)
- Micro Total Reflectance Measurement System (special order)



Lens of Micro Total Reflectance Measurement System (special order)



Total Reflectance Holder of Micro Total Reflectance Measurement System (special order)

### ■ Reflectance Spectrum

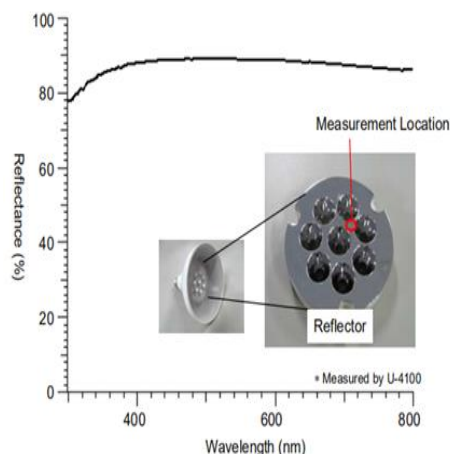


Figure 2 Reflectance Spectrum of Reflector